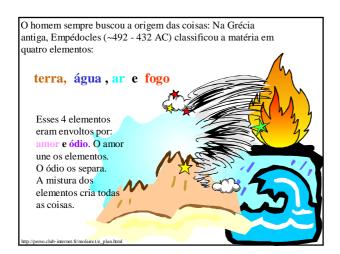
# Universidade de São Paulo Instituto de Física

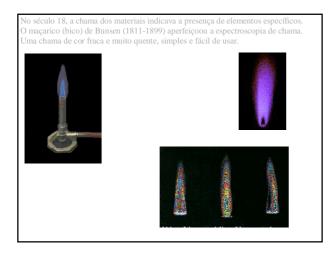
FAP5844 - Técnicas de Raios-X e de feixe iônico aplicados à análise de materiais

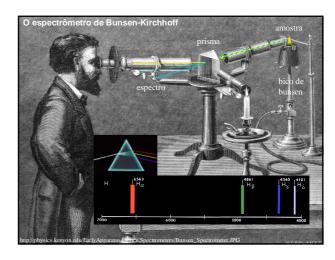
Manfredo H. Tabacniks FI1-2008

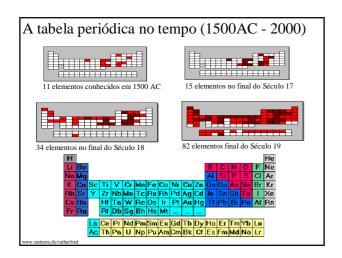
12/08	FI-1	Revisão: Interação de fótons (raios-X) com a matéria para aná elementar: Absorção e emissão de raios-X característicos. Interação de fons energéticos com a matéria: Poder de freamer excitação eletrônica, espalhamento elástico.
19/08	FI-2	Raios-X para análise elementar: Fundamentos dos métodos XRI PIXE. Análise qualitativa e quantitativa elementar.
26/08	FI-3	Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação espectros de raios X. Exemplos e exercícios.
04/09		Laboratório PIXE no LAMFI
05/09 Setembro	2008	
Setembro 02/09	FI-4	RBS. Análise e interpretação de espectros RBS
Setembro : 02/09		RBS. Análise e interpretação de espectros RBS  Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação espectros RBS. Exemplos e exercícios.
Setembro 02/09	FI-4	RBS. Análise e interpretação de espectros RBS  Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação
6etembro : 02/09 16/09	FI-4	Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação e espectros RBS. Exemplos e exercícios.
Setembro : 02/09 16/09 18/09 19/09	FI-4 FI-5	RBS. Análise e interpretação de espectros RBS  Instrumentação, bases de dados e softwares para análise e simulação espectros RBS. Exemplos e exercícios.  Laboratório RBS no LAMFI  Aplicações avançadas: Difusão em filmes finos, rugosidade, film multicamada e multielementares; análise PIXE de amostras espessa

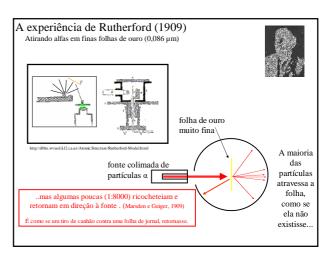


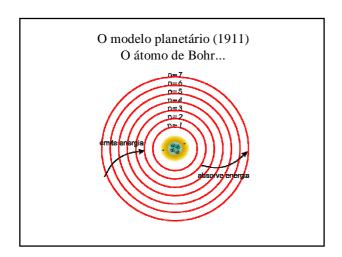


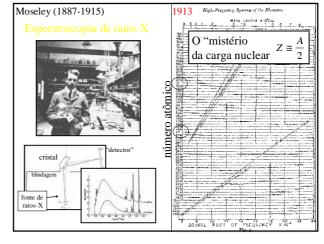


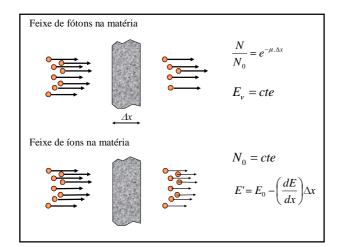


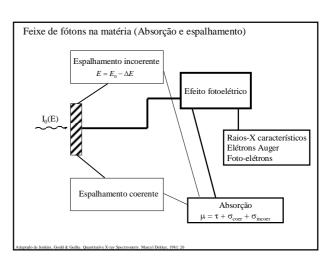


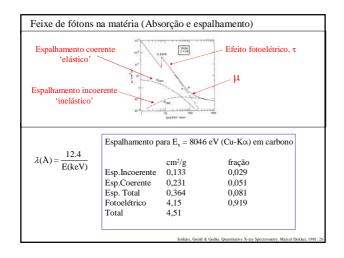


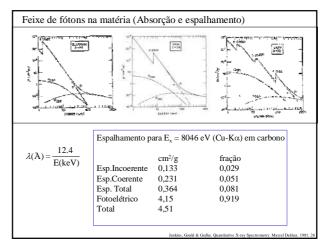






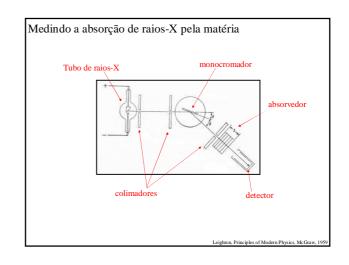




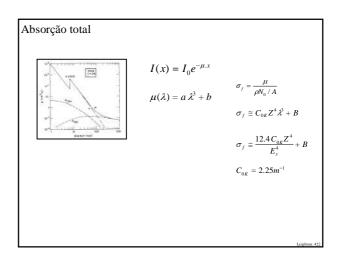


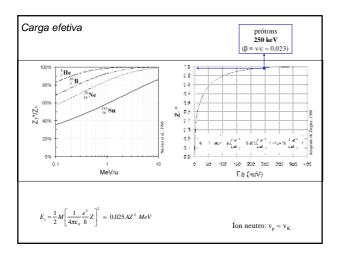
Qual a energia transferida?

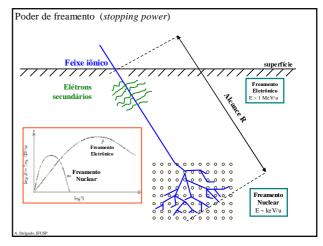
Qual a probabilidade do evento?

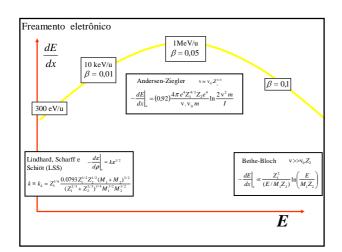


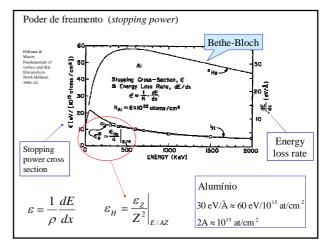
Feixe de fótons na matéria (Absorção e espalhamento) 
$$I(x) = I_0 e^{-\mu .x}$$
 Espalhamento inelástico (Efeito Compton) 
$$\Delta \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$
 
$$\frac{d\sigma_c}{d\Omega} = \frac{1/2 I_0^2 (1 + \cos^2 \theta)}{(1 + 2\varepsilon \sec^2 1/2\theta)^2} \left[ 1 + \frac{4\varepsilon^2 \sec^4 1/2\theta'}{(1 + \cos^2 \theta')(1 + 2\varepsilon \sec^2 1/2\theta')} \right]$$
 Espalhamento elástico 
$$E = h \, \nu = \text{cte} \qquad \sigma_0 = \frac{e^4}{6\pi \varepsilon_0^2 m^2 c^4}$$
 Fração da radiação incidente espalhada por um único elétron. (Espalhamento de Thompson)

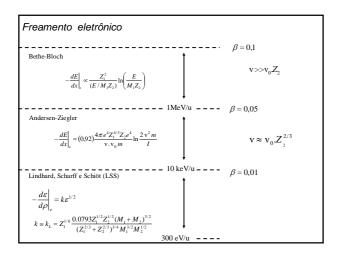


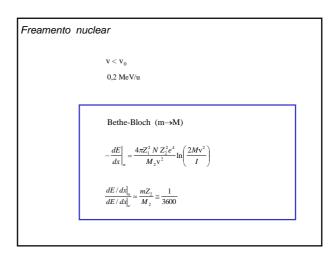


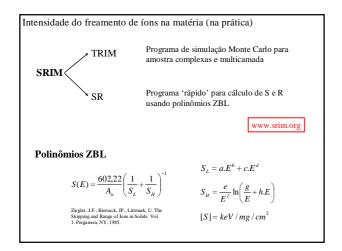


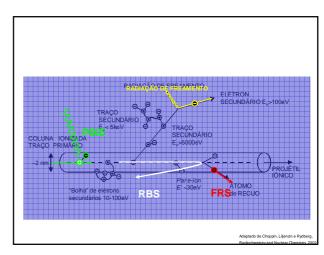


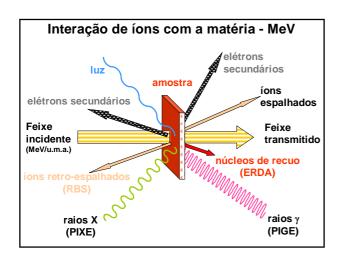


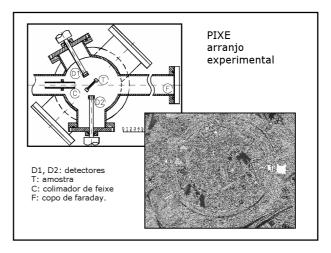


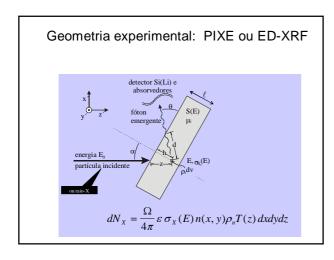


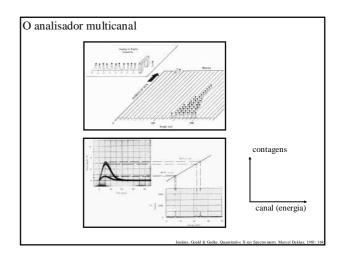


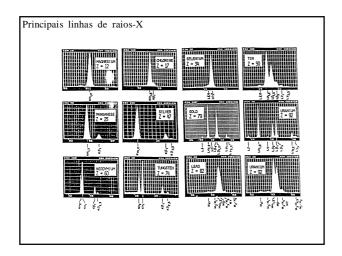


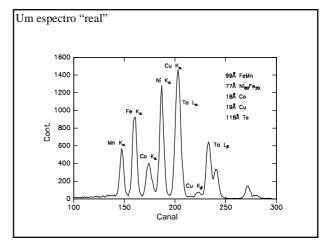


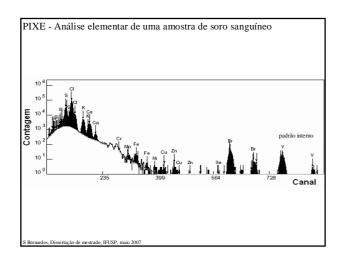


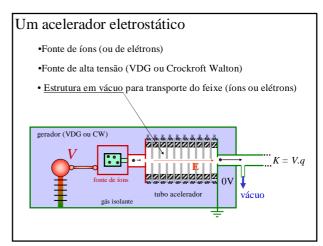


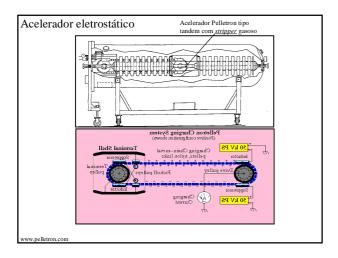


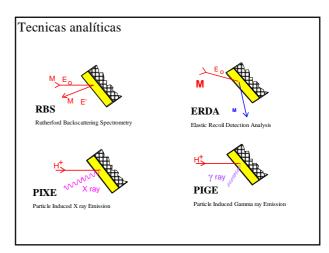












## métodos analíticos

# Rutherford Backscattering Spectrometry ERDA Elastic Recoil Detection Analysis

- alta sensibilidade: < 10<sup>14</sup> Au/cm²
   absoluto: não necessita calibração
   perfil em profundidade ( Δx 100Å)
   rápido: 10-20 min
   sensível à topografia (tese Dr.)

# PIXE Particle Induced X ray Emission PIGE Particle Induced Gamma ray Emission

- alta sensibilidade: ppm (ou 10<sup>14</sup> at/cm²)
   Z > 11
   necessita calibração
   rápido: 10-20 min

Feixe externo para amostras especiais

### medir todos os elementos da tabela periódoca

### SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry

- feixe <sup>16</sup>O, 20 keV, 3μm
   altissima sensibilidade: 10<sup>12</sup> at/cm²
   todos elementos da tabela periódica
   mapa elementar
   imagem por elétrons retroespalhados
   semiquantitativo
   perfil em profundidade (Δx ~ 10 Å)

#### **AMS** Accelerator Mass Spectrometry

- hiper alta sensibilidade: 1: 10<sup>14</sup>
  composição isotópica
  absoluto: não necessita calibração

AMS-2 Accelerator Mass Spectrometry Instalação de um espectrômetro de m no implantador de íons de 300kV. Sensibilidade prevista 10<sup>10</sup> at/cm². (em projeto de viabilidade)

www. if. usp. br/man fredo/fap 5844

www.if.usp.br/lamfi/tutoriais.htm Tutorial 1. Análise de filmes finos por PIXE e RBS